

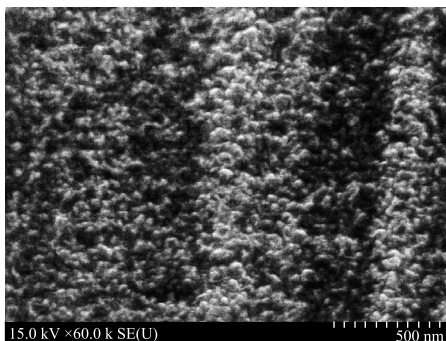
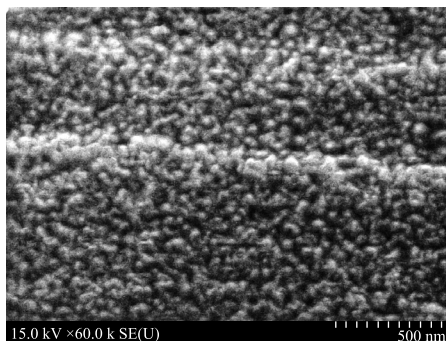
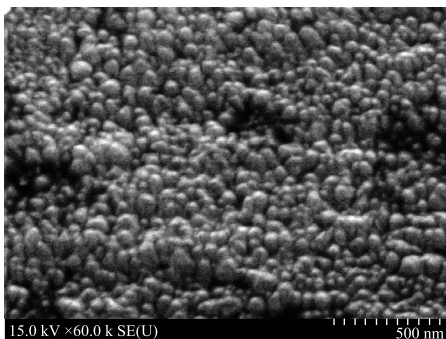
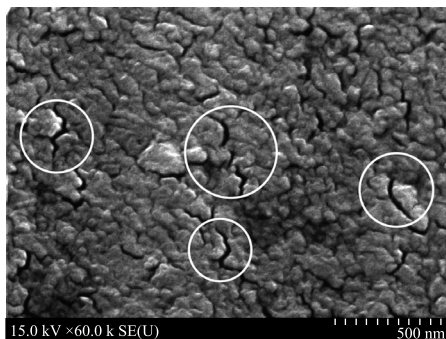
a/a*б/б**в/в**г/г*

Рис. 1. СЭМ-микрофотографии поверхности покрытий TiAlN, облученных ионами Ar^+ с энергией 200 кэВ при температуре 480 °С.

Флюенс облучения, ионов/см²:

a – $2,5 \cdot 10^{16}$; *б* – $5,0 \cdot 10^{16}$; *в* – $1,0 \cdot 10^{17}$; *г* – $2,0 \cdot 10^{17}$.

Окружностями выделены блистеры

Fig. 1. SEM microphotographs of the TiAlN coatings surfaces irradiated with Ar^+ ions with an energy of 200 keV at a temperature of 480 °C.

Irradiation fluence, ions/cm²: *a* – $2.5 \cdot 10^{16}$; *b* – $5.0 \cdot 10^{16}$; *c* – $1.0 \cdot 10^{17}$; *d* – $2.0 \cdot 10^{17}$.

Blisters are highlighted with white circles